

# 株式会社ASTRON

## 公司介绍

# 公司简介

- 公司名称 株式会社ASTRON
- 公司地址 东京都新宿区西新宿3-2-4
- 资本金额 1,000万日元
- 成立日期 1988年（昭和63年）5月
- 事业内容 软件开发及销售  
（主要是EDA（CAD软件）、  
图像处理软件的开发、销售）



## <主要客户>

Advantest

富士通

Panasonic

Elpida Memory, Inc.

索尼

Sony LSI Design Inc.

东芝

Toshiba Solutions Corporation

日立高新技术公司

瑞萨电子株式会社

DENSO

Semiconductor Technology Academic Research Center(STARC)

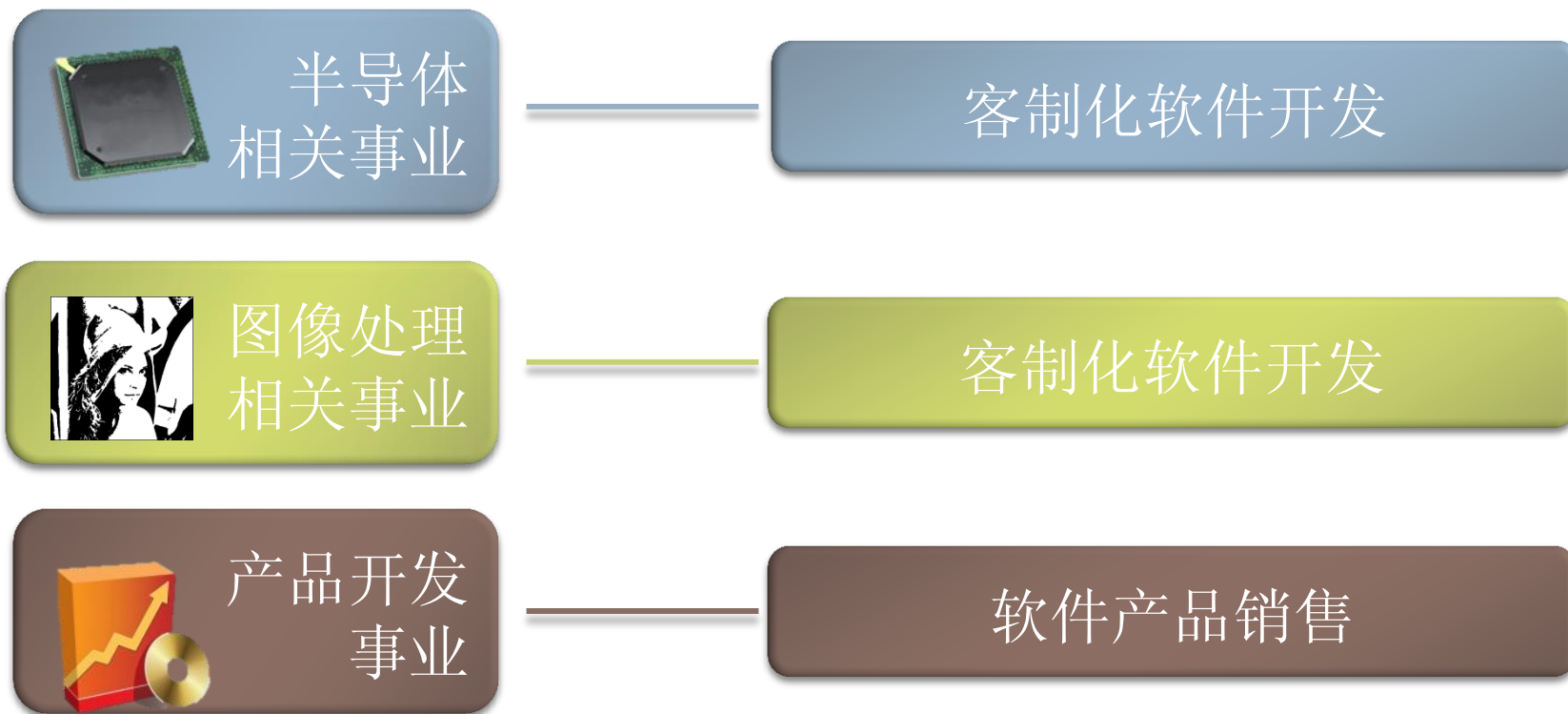
NTT Atsugi Research and Development Center

NTT Musashino Research and Development Center

等

# 业务内容

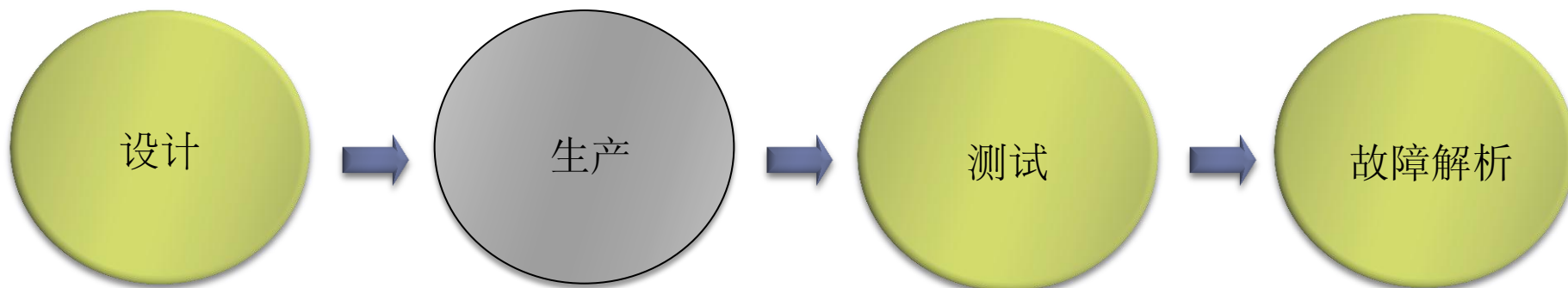
- ▶ 半导体相关 · 图像处理相关软件的开发及产品的销售。



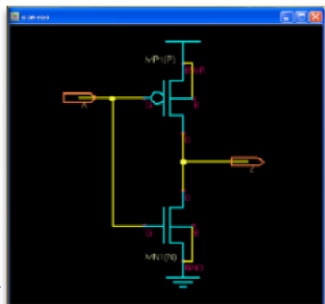
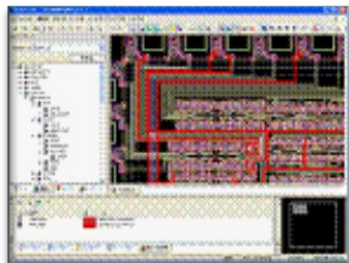
# 半导体相关事业



- ▶ 开发及提供半导体设计・测试・故障解析过程中所使用的支援应用程式。



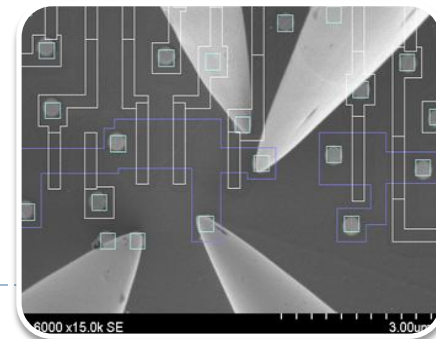
- 提供设计支援应用程式 (CAD软件)



- 提供测试支援应用程式

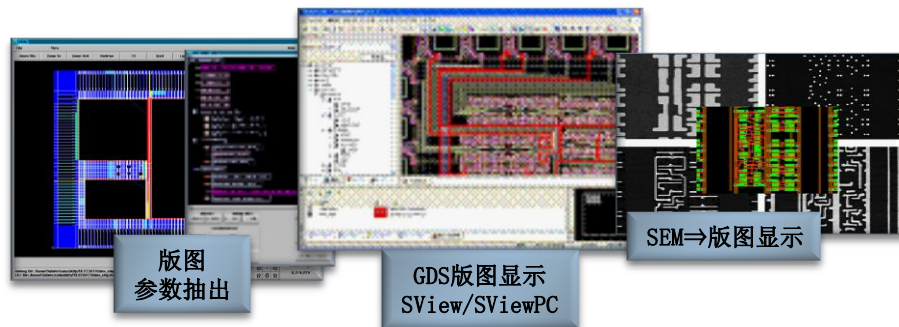
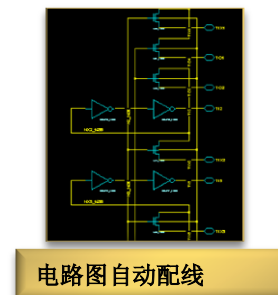
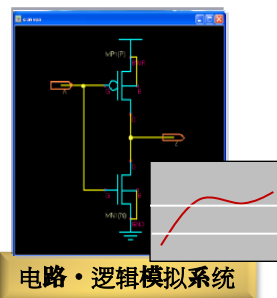
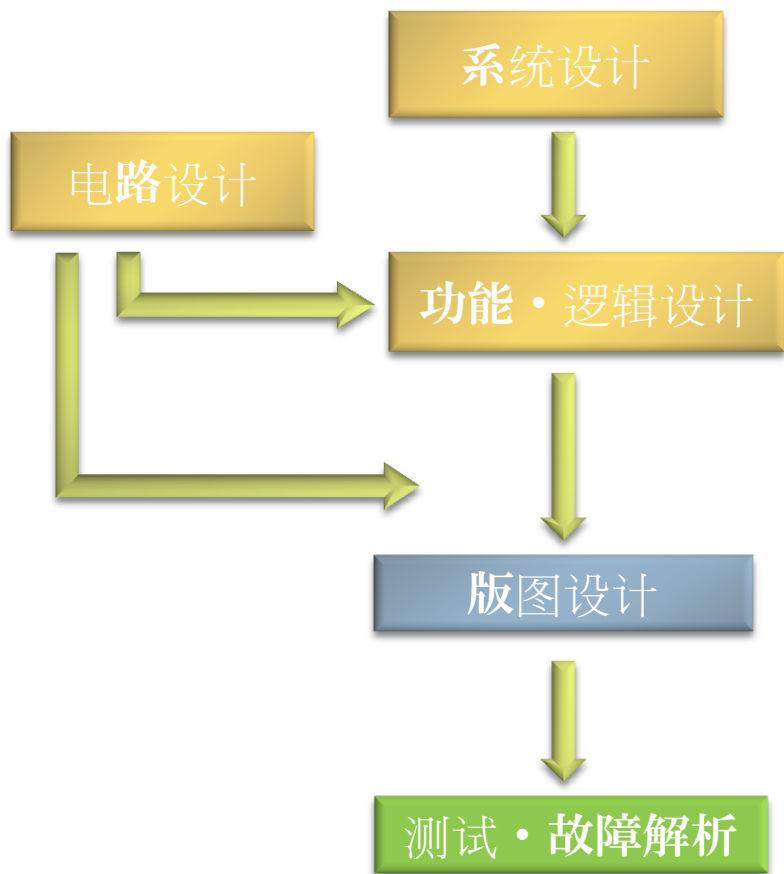


- 提供解析支援应用程式



# 提供LSI（IC）、基板、液晶 各种客制化CAD软件

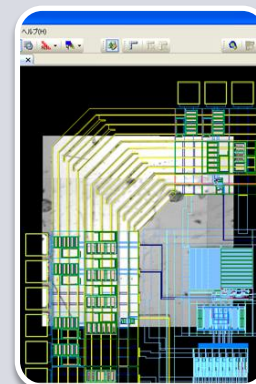
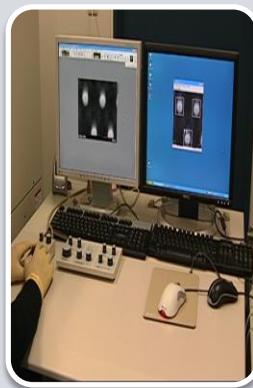
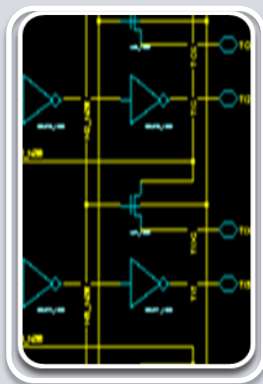
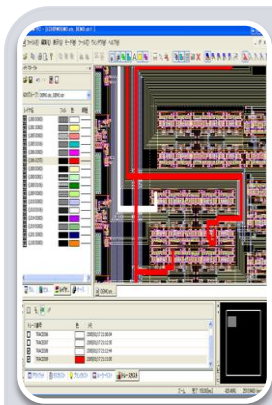
拥有广泛、丰富的客制化CAD软件开发经验。



# 产品开发事业



▶ 半导体相关自有产品的开发・销售。



## SView-PC

- 设计数据高速显示

## Neals

- 提取电路软件

## Marrive

- 图形计数辅助软件

## NASFA

- LSI观测图像和设计数据的比对

## Aries

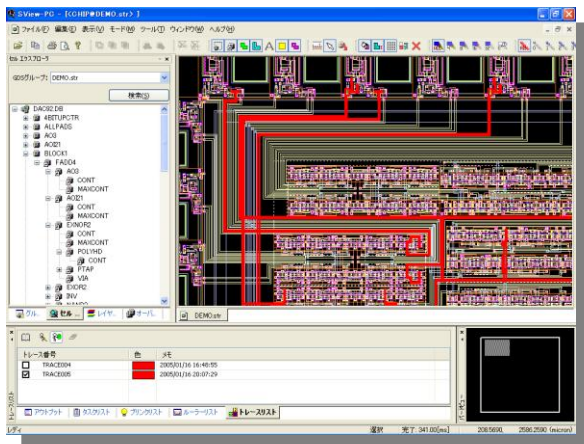
- Emission图像和设计数据的比对

## SEM3D

- 断面图像合成・3D显示软件



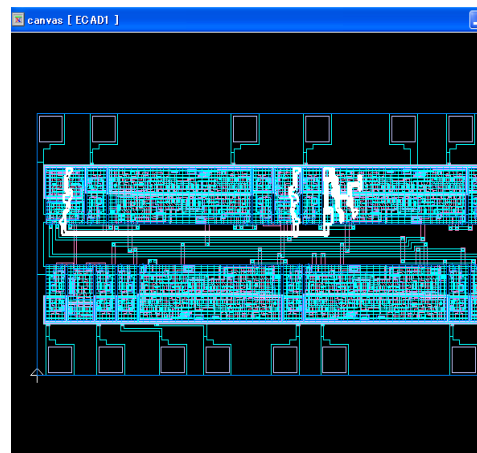
# 设计支援PKG



设计数据高速显示软件

SView-PC

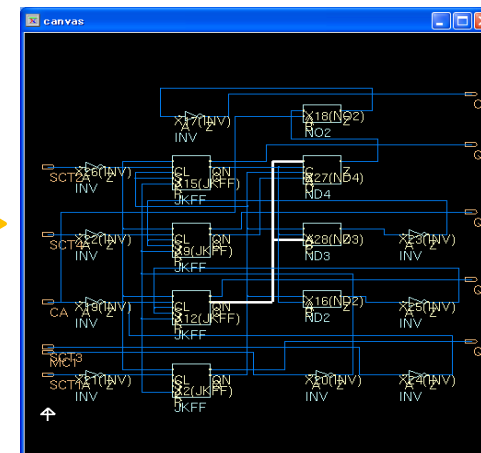
可高速显示大规模的设计数据  
更容易进行设计图面的验证。



电路抽出系统

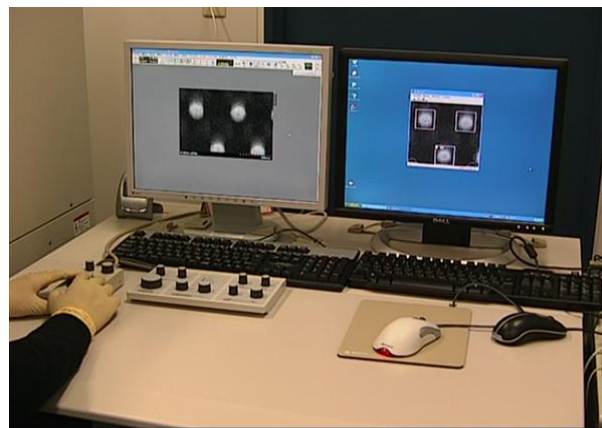
Neals

从设计数据提取电路图进行比较、  
验证。



# 故障解析支援PKG

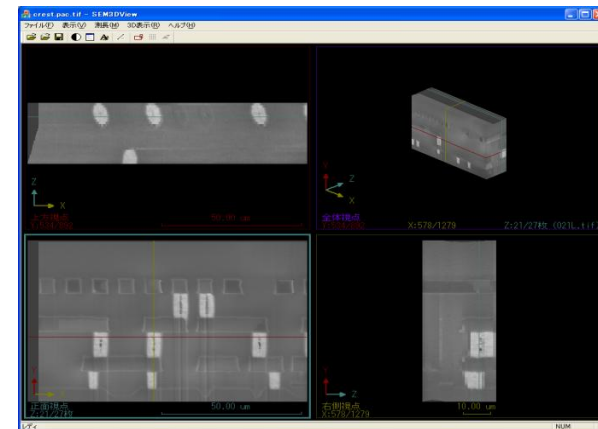
(用于电子显微镜的PKG)



单元计数辅助软件

Marrive

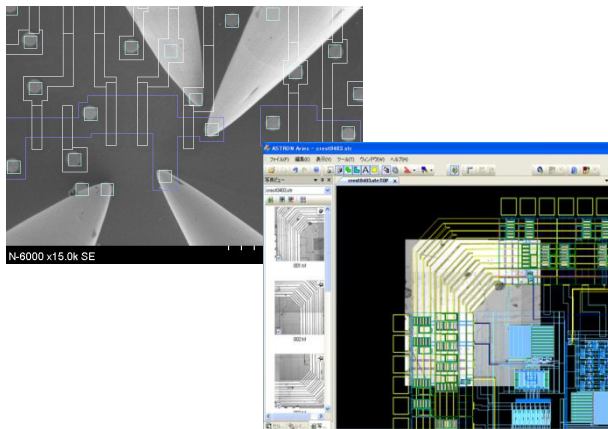
识别存储器、智能手机屏、图像传感器等重复的图形、进行计数测定。



SEM像3D/断面显示软件

SEM3DView

可从多个电子显微镜像建立3D图像，切出任意断面。



CAD导航系统

NASFA · Aries (Off-Ling解析用)

使检查、解析设备的Stage与设计 (CAD) 数据连动、进行检查、解析。



# 图像处理相关事业



- ▶ 开发外观检查（半导体相关・异物・印刷）及工厂内设备的监视系统、电子显微镜图像处理等各种领域的应用程式。



半导体外观检查



异物检查



印刷检查



设备监视



电子显微镜

# 开发实例 (图像处理事业)

	<h3>半导体封装外观检查</h3>	<h3>半导体封装的缺陷检查</h3> <p>(Windows / MIL / Visual C++)</p>
	<h3>湿纸巾异物检查</h3>	<h3>包装好的湿纸巾异物检查</h3> <p>(Windows XP / MIL / Visual C++)</p>
	<h3>餐盒标签检查</h3>	<h3>餐盒上标签的检查 (OCR)</h3> <p>(Windows XP / HALCON / Visual C++)</p>
	<h3>肉类加工设备</h3>	<h3>肉类加工系统GUI</h3> <p>(Windows XP Embedded/ HALCON / Visual C++ / MXComponent / API-DIO)</p>
	<h3>工厂内设备监视</h3>	<h3>监视工厂内设备的动向、出现异常时进行通报</h3> <p>(Windows / MIL / MXComponent / Visual C++)</p>



# 开发实例 (图像处理事业、其他)

	<p>电子显微镜图像校正</p>	<p>校正电子显微镜图像的不规则变动 (Windows / MIL / Visual C++)</p>
	<p>电子显微镜图像计数 (自有开发产品)</p>	<p>分辨/计数电子显微镜图像里的特定图形 (Windows / MIL / Visual C++)</p>
	<p>电子显微镜 粒子解析</p>	<p>计数/测定电子显微镜图像里的粒子数和面积 (Windows / MIL / Visual C++)</p>
	<p>电子显微镜 设计图档 的还原</p>	<p>将电子显微镜图像还原成设计图档 (Windows / MIL / Visual C++)</p>
	<p>Atom probe 解析支援 工具</p>	<p>读取Atom Probe的数据档案、离子的3D显示、原子的组成解析等</p>



## 服务项目 (图像处理事业)

▶ 我们提供影像输入、软件介面(GUI)、设备控制等一系列开发。

### 摄像控制



Area Cameras  
(类比/CameraLink/GigE/USB)

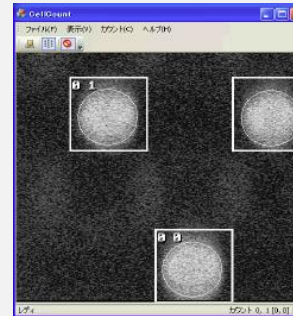


Line camera  
(CameraLink)



FrameGlover  
(Matrox, AVALDATA数据, Linx)

### GUI



### 设备控制



DIO / AIO  
(contec)



Sequencer  
(三菱电机)

# 联络我们

---

如果有任何问题或建议，欢迎随时与我们联络



〈联络方式〉

株式会社ASTRON(产品设计Gr 伊佐)  
〒162-0023 東京都新宿区西新宿3-2-4  
TEL:03-5325-6500 FAX:03-5325-6800  
E-mail: [sales@astron.co.jp](mailto:sales@astron.co.jp)

---

